

『新原理に基づくパターン認識手法』

目 次

1. 講 演

- 「高次局所自己相関特徴を用いた適応的画像計測・認識」 1

電子技術総合研究所 栗田 多喜夫 氏

2. 講 演

- 「学習型汎用画像計測装置AISSによるその場学習と実時間認識のデモ」

. . . 14

応用計測研究所 開発センター 桑島 茂純 氏

3. 研究発表

- 「大島紬むしろの自然染色装置の開発

－ 画像処理による染色縞の位置計測 － . . . 23

福岡工業短期大学 白川 弘明 氏 福岡工業大学 山崎 秀樹 氏

サンテレビジョン 杉田 禎只 氏 古川製作所 峰松 秀男 氏

4. 研究発表

- 「透過写真からの溶接欠陥像の自動検出」 . . . 29

電気通信大学 石井 明 氏 電気通信大学大学院 阿久津 正幸 氏

電気通信大学 越智 保雄 氏

5. 次回研究会案内

. . . 35